

JIS

プロセス計測制御機器—
性能評価の一般的方法及び手順—
第2部：基準状態における試験

JIS C 1805-2 : 2001

(JEMIMA/JSA)

(2006 確認)

平成13年 8 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は、工業標準化法第12条第1項の規定に基づき、社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

今回の制定は、日本工業規格を国際規格に整合させるため、IEC 61298-2：1995を基礎として用いた。

JIS C 1805-2には、次に示す附属書がある。

附属書A(参考) 参考文献

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表

JIS C 1805 の規格群は、次に示す4部から構成する。

JIS C 1805-1 第1部：一般的考察

JIS C 1805-2 第2部：基準状態における試験

JIS C 1805-3 第3部：影響量の効果に関する試験

JIS C 1805-4 第4部：評価報告書の内容

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成13.8.20

官 報 公 示：平成13.8.20

原 案 作 成 者：社団法人 日本電気計測器工業会(〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目9-10 TEL 03-3502-0601)

財団法人 日本規格協会(〒107-8440 東京都港区赤坂4丁目1-24 TEL 03-5770-1573)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会(部会長 杉浦 賢)

審議専門委員会：電気技術専門委員会(委員長 小田 哲治)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省 産業技術環境局標準課 情報電気標準化推進室[〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1 TEL 03-3501-1511(代表)]にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

プロセス計測制御機器— C 1805-2 : 2001
性能評価の一般的方法及び手順—
第2部：基準状態における試験

Process measurement and control devices—
General methods and procedures for evaluating performance—
Part 2 : Test under reference conditions

序文 この規格は、1995年に第1版として発行されたIEC 61298-2, Process measurement and control devices—General methods and procedures for evaluating performance—Part 2 : Test under reference conditionsを翻訳し、編集上及び/又は技術的内容を一部変更して作成した日本工業規格である。

この規格に記載されたIEC規格番号は、1997年1月1日から実施のIEC規格新番号体系によるものである。これより前に発行された規格については、規格票に記載された規格番号に60000を加えた番号に切り換えてある。これは、番号だけの切換えであり、内容は同一である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表をその説明を付けて、**附属書1**に示す。

1. 適用範囲 この規格は、プロセス計測制御機器の機能及び性能に関する試験の実施と報告のための、一般的な方法と手順を規定する。この規格に規定された方法と手順は、いずれの種類の試験又はいずれのタイプのプロセス計測制御機器にも適用できる。各試験は固有の入力変量及び出力変量並びに入力/出力関係(伝達関数)によって特性付けられるいずれの機器にも適用でき、アナログ機器もデジタル機器も含まれる。特別な試験が必要な機器に対しては、この規格は、特別な試験を規定したその製品固有の規格と合わせて使用しなければならない。

JIS C 1805のこの部は、基準状態で行われる試験について述べている。

備考 この規格の対応国際規格を、次に示す。

なお、対応の程度を表す記号は、ISO/IEC Guide 21に基づき、IDT(一致している)、MOD(修正している)、NEQ(同等でない)とする。

IEC 61298-2 : 1995, Process measurement and control devices—General methods and procedures for evaluating performance—Part 2 : Test under reference conditions(MOD)

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発効年(又は発行年)を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0155 : 工業プロセス計測制御用語及び定義

備考 IEC 60902 : 1987, Industrial-Process measurement and control-Terms and definitions からの引用事項は、この規格の該当事項と同等である。

JIS C 1010-1 測定、制御及び研究室用電気機器の安全性 第1部：一般要求事項